# + 國 決 光 第16卷 第7期

## 沟道台面衬底三段大光腔激光器

李玉东 张崇宁 刘式墉 高鼎三 (吉林大学电子科学系,长春)

## Channeled-mesa substrate three-segmented large optical cavity structure semiconductor lasers

Li Yudong, Zhang Chongning, Liu Shiyong, Gao Dingsan (Department of Electronic Sciences, Jilin University, Changchun)

提要:本文报道了一种新型结构的半导体激光器——沟道台面衬底三段大光腔 激光器,它具有阈值电流低、高输出功率和易获得基横模单纵模工作的特点。 关键词:沟道衬底,台面衬底,三段,大光腔激光器

### 一、引言

为满足激光唱盘、激光记录与印刷和信 息处理等领域的需要,稳定的高功率单模激 光器一直是人们研究的课题。设计者们通过 加强电流限制和光限制[1]来提高量子效率, 减小热效应; 在平行结方向引入反导引机 制四增加基模的束斑尺寸; 用侧向吸收和散 射[3]限制侧向高阶模振荡;采用非吸收窗 口[4,5]减少腔面损伤等办法来获得高功率光 输出。在许多高功率激光器中,都尽量减小 垂直方向的光功率限制因子, 使光进入限制 层或波导层内,避免集中在有源层内造成腔 面损伤,因而可以提高功率输出。但激光器 阈值电流密度与光限制因子成反比关系[6],  $J_{th} \propto 1/\Gamma$ , 当光限制因子  $\Gamma$  减小时会使  $J_{th}$ 增大,而阈值电流的增加则容易产生热饱和, 影响增加功率输出,同时也不利于器件的寿 命和可靠性。

为解决上述矛盾,并能使器件在空间场 和频谱上都获得稳定的单模工作,我们提出 一种新结构激光器——沟道台面衬底三段大 光腔激光器 (Channeled-Mesa Substrate Three-Segmented Large Optical Cavity Structure Lasers, 或 CMS-TSLOC 激光器)。 这种激光器的结构如图1所示,是在一个台 面衬底激光器两端连接两个沟道衬底激光器 而形成的一个电学共极光学三段共腔激光 器。利用三段腔各自不同的结构,得到不同 的光限制因子,即台面衬底区 Г 较大而沟道 区 Γ 较小, 这样沟道区的大部分激光可以射 入到波导层中增大了出光面积,减少了腔面 损伤,提高了输出功率。而中间台面衬底区 由于有大的光限制因子,则可以降低器件的 阈值电流,从而三段腔互相补充达到低阈值

收稿日期: 1987年4月3日;修改稿收到期: 1988年7月13日。



(a) CMS-TSLOC 激光器 示意图; (b) 在 CMS-TSLOC 激光器沟道中心的截面图

高功率的目的。在侧向由有源层和波导层的 厚度变化提供弱折射率光限制,为基横模工 作准备了条件,而三段腔之间的光干涉耦合 作用又使激光器易于获得单纵模运行。目前 我们研制的这种 CMS-TSLOC 激光器已获 得室温连续工作 (CW),最低直流阈值为 40 mA,线性功率输出可达 40 mW,外微分量 子效率最高为 60% (双面),获得了 3°C 的直 流工作单纵模温度锁定。在 18~70°C 范围 内得到了较高的特征温度  $T_0=150$ °C,基横 模工作以较窄的远场角 (30°×6°)可保持 16 mW 以上。

#### 二、器件制造工艺

首先在晶向为(100)n+-GaAs (掺 Si, (1 ~3)×10<sup>18</sup> cm<sup>-3</sup>)衬底片上,沿(011)方向刻 蚀单双交错的倒梯形槽, 深度为 3~4μm。然 后依次外延五层结构: 1.n-Ga.62Al.38As, (掺 Te (1~2) × 10<sup>18</sup> cm<sup>-3</sup>); 2. n-Ga.82Al.18As (掺 Sn, (3~5)×1017 cm-3); 3. n-GaAs(非 故意掺杂); 4. p-Ga.62Al.38As (掺 Ge, (4~ 6) × 10<sup>17</sup> cm<sup>-3</sup>); 5. p-GaAs (掺 Ge, 1×10<sup>17</sup>) cm-3)。外延生长温度为780~800℃,生长 第一层时有6~8℃的过冷度并且降温速率 为0.8°C/分,避免台面部分尖角回溶。表1 给出了在电极条中心处沟道区和台面区外延 层厚度, 为便于比较同时也给出了两区的外 延层高度差和平面区的层厚。 其中沟宽 W。 =10~14 µm, 台宽 Wm=14~18 µm。非平 面衬底表面曲率的大小和正负对液相外延影 响很大, 凸面生长速率小而凹面生长速率 大<sup>[7,8]</sup>,由表1看到前两层生长中沟道区比 台面区几乎快3~5倍。正是利用这一特点 我们在沟道区和台面区分别得到厚度差异很 大的波导层,而由于光功率限制因子对波导 层厚度的依赖,导致这两个区域的光限制因 子的不同。图2是沟道区和台面区外延层次 剖面的显微镜照片,可清楚地看到两区厚度

区域	外延层				
	<i>n</i> -Ga <sub>.62</sub> A1 <sub>.38</sub> As	n-Ga.82Al.18As	n-GaAs	p-Ga.62Al.38As	<i>p</i> −GaAs
平面	1.2~1.4	0.25~0.3	0.15~0.2	1.5~1.75	0.8~1.0
台面	0.8~1.0	0.15~0.25	0.1~0.2	1.9~2.2	0.7~0.8
沟道	3.1~3.5	1.0~1.2	0.15~0.25	2.0~2.25	0.8~1.0
沟台高度差	-1.2~-1.0	-0.45~-0.05	-0.4~-0.1	-0.3~0	0.1~0.2

表1 沟道区和台面区外延层厚度的比较(µm, 沟深3.5µm)



图 2 CMS-TSLOC 激光器的横截面照片 (金相显微镜) (a) 沟道衬底部分; (b) 台面衬底部分

#### 的比例。

制备好的外延片, 经沉积 SiO<sub>2</sub> 膜、光刻 刻蚀窗口 ( $W_s = 8 \sim 10 \ \mu m$ )、Zn 扩散、蒸发 电极等工艺后可解理管芯, 解理位置在沟道 区内,沟道区腔长  $L_e = 30 \sim 50 \ \mu m$ , 台面区腔 长  $L_m = 100 \sim 200 \ \mu m$ 。

#### 三、CMS-TSLOC 激光器的特性

 國值特性。腔长为 180 μm~300μm
 的激光器。室温直流工作条件下的阈值电流 为 40~120 mA。

2. 连续输出功率特性。图 3 给出了几个 CMS-TSLOC 激光器室温直流工作条件下 输出光功率与注入电流的关系曲线。测得的 外微分量子效率一般为 40~60%(双面)。图 3(a)中的几个器件线性功率超过 16mW, 而 (b)中的激光器输出可达 40mW 保持线性。

3. 光场分布。由于 CMS-TSLOC 激光 器具有侧向弱折射率限制和出光面积大的特 点,因此能获得稳定的基横模工作和较窄的 光发散角,图 4 所示的 867-17 日4 激光器的 远场分布已证实了这一点,基横模保持到 16 mW,水平与垂直的远场半宽分别为 6°和 30°。



图 3 CMS-TSLOC 激光器典型的 P-1 曲线 (CW)



(a) 平行结平面; (b) 垂直结平面

4. *P*−*I* 曲线随温度的变化。 图 5 给 出 了 在 直 流 工 作 时 X4−3<sup>#</sup> 器件 *P*−*I* 曲线随 温度变化的实验结果。可以看出随温度升高 阈值电流逐渐增大,但速度不是很快,在 105°C 时激光器仍然能有 3.7 mW 的功率输 出。由测得的结果和熟知的经验公式  $I_{th}(T)$ =  $I_{th}(T') \exp\left(\frac{T-T'}{T_0}\right)$ (式中  $I_{th}$  表示阈值电 流, *T* 为工作温度, *T'* 为参考温度, *T*<sub>0</sub> 是标志 激光器温敏性的特征温度)。 我们获得的 *T*<sub>0</sub> 在18~70°C之间约为 150°C,在 70~100°C 绝



对高温区  $T_0 = 100$  °C, 从这里可以看出这种器件温敏性较好。

5. 纵模及温度锁定特性。图 6 是 几 个 CMS-TSLOC 激光器在室温直流条件下实现 单纵模工作的光谱。获得单纵模的工作电流 在  $1.15I_{th} \sim 1.5I_{th}$ 之间。图 7 是一个 CMS-TSLOC 激光器在固定工作电流条件下改变 热沉温度, 而测得的激光波长随温度变化的 结果。工作电流 I = 62 mA,  $I_{th} = 55 \text{ mA}$ , 腔 长  $L_m = 140 \mu m$ ,  $L_c = 30 \mu m$ , 总腔长 L =200  $\mu$ m。由图中可以看出, 大约经 3 °C 左右 模式才发生跳动, 而在锁定范围内单纵模保 持不变, 而且波长随温度的变化率也较小, 从 图中的三个连续区中, 波长随温度的变化率



图 7 一个 CMS-TSLOC 激光器在 1.31th 条件下,激光波长与温度的关系及在 26.5、 27.5、和 30°C 时的激光光谱

分别为 0.092 nm/°C、 0.073 nm/°C、 0.102 nm/°C。对于 CMS-TSLOC 激光器由于沟 道区和台面区存在着弱反射界面,会引起三 段腔纵模之间发生干涉和耦合作用,因此易 于实现单纵模和具有一定的温度锁定效应。

#### 四、讨 论

CMS-TSLOC 激光器的主要特点之一是 在激光器沟道区和台面区中存在着数值不同 的光功率限制因子,因而具有既增加腔面束 斑尺寸提高输出功率,又能降低阈值电流的 优点。如用 Γ 表示激光器垂直方向的光限 制因子,则可用下面简单关系来说明沟道区 和台面区的作用:

$$\Gamma = \frac{2L_c}{L} \Gamma_c + \frac{L_m}{L} \Gamma_m \qquad (1)$$

其中  $L_c$ 、 $L_m$ 、 $\Gamma_c$ 、 $\Gamma_m$ 分别为沟道区和台面区的 腔长及光限制因子( $L=2L_c+L_m$ )。(1)式 是对称情况(两个沟道区腔长相等)。

当  $L_m \gg L_c$ ,  $\Gamma_m \gg \Gamma_o$  时,  $\mathfrak{sh}$  (1) 知  $\Gamma \simeq \Gamma_m$ , 而设计较大的  $\Gamma_m$  无疑会使激光器的阈 值电流降低 ( $J_{th} \propto 1/\Gamma \simeq 1/\Gamma_m$ )。而较小的  $\Gamma_o$ 则使激光器两端的沟道区的光大部分存在于 波导层中,增大了出光面积,起到了光输出窗口作用。当 $L_o=0$ 或 $L_m=0$ 时,(1)式变为均匀腔情况,沟道衬底或台面衬底激光器。这两种器件都不可能既存在较大的 $\Gamma$ 又有光输出窗口作用的优点。

在 CMS-TSLOC 激光器中,利用有源区 和波导区的侧向厚度变化提供了保证基横 模工作的侧向弱折射率光限制, 但这种变化 也使 $\Gamma_o$ 和 $\Gamma_m$ 的计算较复杂,为便于分析其 特点和粗略定量估计,并考虑到沟道区和台 面区厚度差异很大,有源层侧向厚度变化较 缓,可忽略侧向厚度的变化,近似成四层平面 大光腔波导来分析, 各层折射率为 n1=n4= 3.33 (限制层);  $n_2=3.59$ (有源层);  $n_3(x)=$ 3.59-0.71x+0.09x<sup>2</sup>(波导层), x 为波导层 组份, d2、d3分别为有源层和波导层的厚度。 图 8 给出了 TEo 模的光功率限制 因子  $\Gamma$  和  $d_3$ 的关系,这里的 $\Gamma$ 可以是 $\Gamma_m$ 也可以是  $\Gamma_c$ ,差别仅在于 $d_3$ 不同。曲线1、2表示波 导层组份 x 分别取0.1和0.2 时的情况。可以 看到当 $d_3$ 增大时 $\Gamma$ 逐渐减小,当x值小时,



图 8 平面大光腔结构 TE。模的光功率限制 因子 Γ 与波导层厚度 d<sub>3</sub> 的关系

Γ减小的幅度较大,在 $d_2=0.1\sim0.2 \mu m$ 范 围内这种特点更突出。以 $d_2=0.1$ , x=0.1情况为例,当台面区和沟道区波导层厚度 $d_3$ 分别是 $0.15 \mu m$ 和 $1.00 \mu m$ 时,由图8可 查出 $\Gamma_m$ 和 $\Gamma_o$ 约为0.3和0.05,是6:1的 关系。按此数据设计的均匀腔激光器(沟道 衬底激光器或台面衬底激光器),如果不考虑 侧向光限制、注入载流子分布和增益分布的 差异,则这两个激光器的阈值电流也会相差 6倍,用上述参数设计 CMS-TSLOO 激光器 并取 $L_m=200 \mu m$ , $L_c=30 \mu m$ 时, $\Gamma$ 为0.24, 与沟道激光器相比阈值电流可降低近5倍。 因此 $\Gamma_m 与 \Gamma_o$ 相差较大, $L_m \gg L_c$ 对获得低 阈值高功率输出极有好处。

#### 五、结语

我们研制的新结构半导体激光器——沟 道台面衬底三段大光腔激光器具有阈值低、 线性输出好和便于实现稳定的单模工作等优 点,因此这种激光器是很有前途的器件。

谨向苏士昌、张淑芝、张玉贤、胡礼忠、金 恩顺等同志对本工作的支持表示感谢。

#### 参考文献

- R. J. Fu et al., Appl. Phys. Lett., 45(7), 716 (1984)
- 2 D. Botez, Appl. Phys. Lett., 36(3), 190(1980)
- 3 K. Hamada et al., IEEE J. Quant. Electr., QE-21(6), 623(1985)
- 4 Y. Suzuki et al., Electron. Lett., 20(9), 383(1984)
- 5 H. Blauveit et al., Appl. Phys. Lett., 40(12), 1029(1982)
- 6 H. C. Casey, Jr., M. B. Panish, Heterostructure Lasers (Academic Press, New York, 1978), p. 183
- 7 K. Funakoshi et al., J. Crystal Growth, 45, 252 (1978)
- 8 D. Botez, J. Crystal Growth, 70, 150(1984)